# **Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev** Lekce 7: Teplotní závislosti fononové odezvy, vícefononové excitace

#### Daniel Franta

Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

14. 5. 2020

#### Vliv teploty na fononovou odezvu

- 2) Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3) Změna maticového elementu
- 4 Změna statistického teplotního faktoru
- 5) Změna frekvence elementárních procesů
- 5 Změna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

Vliv teploty na fononovou odezvu

$$F(E) = \frac{(eh)^2}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 V} \sum_{i,f}^{f \neq i} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) \frac{|\langle f | \hat{p}_{xe} | i \rangle|^2}{(E_f - E_i)} [\delta(E_f - E_i - E) + \delta(E_i - E_f - E)]$$

Teplota ovlivňuje dielektrickou odezvu pěti způsoby:

Skrze roztažnost atomové mříže. Mění se celková suma

$$N(T) = \int_0^\infty E \,\varepsilon_{\rm i}(E) {\rm d}E = N^{300{\rm K}} \frac{V(T_{\rm R})}{V(T)}$$

 $N^{300K}$  – celková síla přechodů (hustota nabitých částic) při referenční teplotě.  $T_{\rm R}$  – referenční teplota (v našich modelech 300 K).

- Změnou pravděpodobnosti elementárních excitací (procesů) skrze maticový element.
- Změnou pravděpodobnosti elementárních excitací (procesů) skrze statistický teplotní faktor.
- Změnou energie (frekvence) elementárních excitací. Posouvá struktury ve spektru (rudý posuv).
- Změnou pravděpodobnosti rozptylových procesů ovlivňující dobu života a rozostření elementárních stavů. Ovlivňuje ostrost struktur.



- 2 Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3) Změna maticového elementu
- 4 Změna statistického teplotního faktoru
- 5) Změna frekvence elementárních procesů
- 3 Změna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

## Teplotní roztažnost atomové mříže – efektivní fonony

• Lineární teplotní roztažnost e(T)

$$e(T) = \frac{L(T) - L(T_{\rm R})}{L(T_{\rm R})}$$

• Expanzní faktor  $\mathcal{E}(T)$ 

$$N(T) = N^{300K} \mathcal{E}(T)$$
$$\mathcal{E}(T) = \frac{V(T_R)}{V(T)} = \left[\frac{1}{1 + e(T)}\right]^3$$

 V první aproximaci lze předpokládat, že lineární teplotní roztažnost závisí lineárně na obsazovacích číslech jednotlivých fononů

$$e(T) = e_0 + \sum_j \frac{e_j}{\exp(\Theta_j/T) - 1}$$

 $e_0$  – je hodnota pro teplotu 0 K, která se určí z podmínky  $e(T_R) = 0$ .

- $\Theta_j$  energie fononu vyjádřená v K.
- e<sub>j</sub> vliv jednotlivých fononů.

*j* – mělo by se sčítat přes všechny fonony v Brillouinově zóně, ale v praxi stačí jen malý počet tzv. efektivních fononů (**průměrný Bose–Einsteinův faktor**).

Teplotní roztažnost atomové mříže – efektivní fonony



Expanze c-Si je dobře známá z interferometrických měření:  $e_1 = -0.0001947(13)$   $e_2 = 0.00262(9)$   $e_3 = 0.00088(8)$   $e_4 = 0.0023(3)$   $\Theta_1 = 199.6(4) \text{ K} \approx 4.16 \text{ THz (TA)}$   $\Theta_2 = 612(4) \text{ K} \approx 12.8 \text{ THz (LA,LO)}$   $\Theta_3 = 894(24) \text{ K} \approx 18.6 \text{ THz}$  $\Theta_4 = 3721(141) \text{ K} \approx 77.5 \text{ THz}$ 

Maximální frekvence TO v  $\Gamma$  je 15.8 THz.

Expanzním faktorem lze potom všechny příspěvky korigovat (nejenom fonony). Potom i elektronové excitace jsou závislé na Bose–Einsteinově statistice, i když to jsou fermiony. Nezanedbatelné 10-20% v transparentní oblasti

Daniel Franta (Ústav fyzikální elektroniky)



2) Teplotní roztažnost atomové mříže – efektivní fonony

#### 3 Změna maticového elementu

- Změna statistického teplotního faktoru
- 5) Změna frekvence elementárních procesů
- 6 Změna rozšíření elementárních procesů

#### Vícefononové procesy

Změna maticového elementu

$$F(E) = \frac{(eh)^2}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 V} \sum_{i,f}^{f \neq i} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) \frac{|\langle f | \hat{p}_{xe} | i \rangle|^2}{(E_f - E_i)} [\delta(E_f - E_i - E) + \delta(E_i - E_f - E)]$$

Mimo fázové přechody je možné tato závislost **zanedbat**. Alespoň v to doufáme (překryvové integrály by na změně hustoty neměly příliš záviset).

- Vliv teploty na fononovou odezvu
- 2 Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3) Změna maticového elementu
- 4 Změna statistického teplotního faktoru
- 5 Změna frekvence elementárních procesů
- 6 Změna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

Změna statistického teplotního faktoru

$$F(E) = \frac{(eh)^2}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 V} \sum_{i,f}^{f \neq i} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) \frac{|\langle f|\hat{p}_{xe}|i\rangle|^2}{(E_f - E_i)} [\delta(E_f - E_i - E) + \delta(E_i - E_f - E)]$$

Závisí na typu kvazičástic (bozony, fermiony) a na typu elementárních procesů.

Fonony (obsazení fononových stavů) se řídí Bose-Einsteinovou statistikou:

$$\langle n_{\rm ph} \rangle = f^{\rm BE}(E_{\rm ph},T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E_{\rm ph}}{k_{\rm B}T}\right) - 1}$$

Jednofononové procesy

$$F_{1\text{ph}}(E,T) = N_{\text{ph}}^{300\text{K}} \left[ \left( 1 + f^{\text{BE}}(E_{\text{ph}},T) \right) \, \delta(|E| - E_{\text{ph}}) \right]$$
$$-f^{\text{BE}}(E_{\text{ph}},T) \, \delta(|E| - E_{\text{ph}}) \left] \, \mathcal{E}(T) =$$
$$N_{\text{ph}}^{300\text{K}} \, \delta(|E| - E_{\text{ph}}) \, \mathcal{E}(T)$$

Tedy teplota neovlivňuje pravděpodobnost jednofononových procesů ani skrze maticový element ani skrze statistický teplotní faktor. Toto neplatí u vícefononových procesů.

- Vliv teploty na fononovou odezvu
- 2 Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3) Změna maticového elementu
- Změna statistického teplotního faktoru
- 5 Změna frekvence elementárních procesů
- Izměna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

Změna frekvence elementárních procesů

$$F(E) = \frac{(eh)^2}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 V} \sum_{i,f}^{f \neq i} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) \frac{|\langle f | \hat{p}_{xe} | i \rangle|^2}{(E_f - E_i)} [\delta(E_f - E_i - E) + \delta(E_i - E_f - E)]$$

Vlivem expanze prostředí se změní i energie mikrostavů E<sub>i</sub>.

$$F_{1\rm ph}(E,T) = N_{\rm ph}^{300\rm K} \,\delta(|E| - E_{\rm ph}(T)) \,\mathcal{E}(T)$$

Energie fononu lze potom v první aproximaci modelovat pomocí efektivních fononů podobně jako lineární teplotní roztažnost

$$E_{
m ph}(T) = E_{
m ph}^{
m 0K} + \sum_j rac{lpha_j}{\exp(\Theta_j/T) - 1}$$

Většinou stačí pouze jeden efektivní fonon

$$E_{\rm ph}(T) = E_{\rm ph}^{\rm 0K} + \left(E_{\rm ph}^{\rm 300K} - E_{\rm ph}^{\rm 0K}\right) \frac{\exp(\Theta_{\rm ph}/T_{\rm R}) - 1}{\exp(\Theta_{\rm ph}/T) - 1}$$

- Vliv teploty na fononovou odezvu
- 2 Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3) Změna maticového elementu
- 4 Změna statistického teplotního faktoru
- 5) Změna frekvence elementárních procesů
- Změna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

# Změna rozšíření elementárních procesů

Výsledný příspěvek do dielektrické funkce je nutné rozšířit

$$\hat{\varepsilon}_{1\rm ph}(E,T) \equiv \hat{\chi}_{1\rm ph}(E,T) = \hat{\beta} * \frac{F_{1\rm ph}(E,T)}{E} = \frac{N_{\rm ph}^{300\rm K}}{E_{\rm ph}(T)} \left[ \hat{\beta}(E - E_{\rm ph}(T)) - \hat{\beta}(E + E_{\rm ph}(T)) \right] \, \mathcal{E}(T)$$

kde komplexní rozšiřovací funkce  $\hat{\beta}$  obsahuje parametry  $B_{\rm ph}(T)$ , které opět mohou být modelované pomocí efektivních fononů (fononu).

$$B_{\rm ph}(T) = B_{\rm ph}^{\rm 0K} + (B_{\rm ph}^{\rm 300K} - B_{\rm ph}^{\rm 0K}) \frac{\exp(\Theta_{\rm ph}/T_{\rm R}) - 1}{\exp(\Theta_{\rm ph}/T) - 1}$$

- Vliv teploty na fononovou odezvu
- Teplotní roztažnost atomové mříže efektivní fonony
- 3 Změna maticového elementu
- 4 Změna statistického teplotního faktoru
- 5) Změna frekvence elementárních procesů
- Změna rozšíření elementárních procesů
- Vícefononové procesy

## Vícefononové procesy v c-Si

Fononové disperzní relace krystalického křemíku jsou dány translační symetrií:





Fonon je popsán větví (TA<sub>1</sub>, TA<sub>2</sub>, LA, LO, TO<sub>1</sub>, TO<sub>2</sub>) a vlnovým vektorem *k*. Pro absorpční a emisní procesy platí zákony zachování energie a hybnosti:

$$\sum_p \pm E_p = \pm E \,, \qquad \sum_p \pm k_p = 0 \,,$$

kde +/- na levé straně značí kreaci/anihilaci fononu a na pravé straně absorpci/emisi fotonu s energii *E* (hybnost fotonu  $\rightarrow$  0). Pro absorpci fotonu za současného vzniku dvou fononu nebo vzniku a zániku jednoho fononu platí:

$$E_A + E_B = E$$
,  $k_A = -k_B = k$  nebo  $E_A - E_B = E$ ,  $k_A = k_B = k$ 

#### Funkce síly přechodu systému při konečné teplotě

$$F(E,T) = \frac{\pi}{\epsilon_0 V} \left(\frac{e\hbar}{m_{\rm e}}\right)^2 \sum_{i,f}^{i\neq f} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) \frac{|\langle f|\hat{p}_x|i\rangle|^2}{E_f - E_i} \left[\delta\left(E_f - E_i - E\right) + \delta\left(E_i - E_f - E\right)\right]$$

- e, ħ, ϵ<sub>0</sub>, m<sub>e</sub>, k<sub>B</sub>: elementární náboj, redukovaná Planckova konstanta, permitivita vakua, hmotnost elektronu, Boltzmannova konstanta
- V: objem systému
- |*i*>, |*f*>, *E<sub>i</sub>*, *E<sub>f</sub>*: vlastní stavy a odpovídající vlastní energie systému
- T, Ω: termodynamická teplota a termodynamický potenciál

$$\sum_{i} \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_{\rm B}T}\right) = 1$$

Efektivní operátor hybnosti získaný s celkového dipólového operátoru

$$\hat{p}_x = \frac{\mathrm{i}m_{\mathrm{e}}}{e\hbar}[\hat{H}_0, \hat{d}_x] = \hat{p}_{x\mathrm{e}} - \frac{Z_{\mathrm{Si}}m_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{Si}}}\hat{p}_{x\mathrm{Si}}$$

## Dvoufononové procesy

Jelikož chceme vyjádřit příspěvek od **dvoufononových procesů**, rozdělíme systém na dva fonony *A* a *B* a zbytek systému:

$$F_{2ph}(E,T) = \frac{\pi}{\epsilon_0 V|E|} \left(\frac{e\hbar}{m_e}\right)^2 \sum_{A,B} \sum_{k\in BZ} \sum_i \exp\left(\frac{\Omega - E_i}{k_B T}\right)$$

$$\times \left[\sum_{\substack{n_{A,k}=0\\ n_{B,-k}=1}}^{\infty} \sum_{\substack{n_{B,-k}=1\\ n_{B,-k}=1}}^{\infty} |\langle i, n_{A,k} + 1, n_{B,-k} + 1|\hat{p}_x|i, n_{A,k}, n_{B,-k}\rangle|^2 c_{A,B,k}^+ \delta \left[E_{A+B}(k) - |E|\right]\right]$$

$$- \sum_{\substack{n_{A,k}=1\\ n_{B,k}=0}}^{\infty} \sum_{\substack{n_{B,-k}=1\\ n_{B,k}=1}}^{\infty} |\langle i, n_{A,k} - 1, n_{B,-k} - 1|\hat{p}_x|i, n_{A,k}, n_{B,-k}\rangle|^2 c_{A,B,k}^- \delta \left[E_{A-B}(k) - |E|\right]$$

$$+ \sum_{\substack{n_{A,k}=0\\ n_{A,k}=1}}^{\infty} \sum_{\substack{n_{B,k}=1\\ n_{B,k}=0}}^{\infty} |\langle i, n_{A,k} - 1, n_{B,k} + 1|\hat{p}_x|i, n_{A,k}, n_{B,k}\rangle|^2 c_{A,B,k}^- \delta \left[E_{A-B}(k) - |E|\right]$$

$$c_{A,B,k}^{\pm} = \exp\left(-\frac{n_{A,k}E_A(k) + n_{B,\mp k}E_B(\mp k)}{k_{\rm B}T}\right) \qquad E_{A\pm B}(k) = E_A(k) \pm E_B(\mp k)$$

Předpokládáme, že fonon A má větší energii než fonon B.

Daniel Franta (Ústav fyzikální elektroniky)

Pro odvození základní teplotní závislosti skrze statistický faktor použijeme základní předpoklad kvazičásticového přístupu:

 $|\langle i, n_{A,k} + 1, n_{B,-k} + 1 | \hat{p}_x | i, n_{A,k}, n_{B,-k} \rangle|^2 \approx (n_{A,k} + 1) (n_{B,-k} + 1) |\langle i, 1, 1 | \hat{p}_x | i, 0, 0 \rangle|^2$ respective

$$|\langle i, n_{A,k} + 1, n_{B,k} - 1 | \hat{p}_x | i, n_{A,k}, n_{B,k} \rangle|^2 \approx (n_{A,k} + 1) n_{B,k} |\langle i, 1, 0 | \hat{p}_x | i, 0, 1 \rangle|^2$$

Funkci síly přechodu potom můžeme psát jako součet dvou členů:

$$F_{2ph}(E,T) = \sum_{A,B} [F_{A+B}(E,T) + F_{A-B}(E,T)]$$

kde oba členy můžeme rozepsat pomocí teplotního faktoru a funkce, která na teplotě nezávisí (v prvním přiblížení):

$$F_{A\pm B}(E,T) = \sum_{\mathbf{k}\in\mathsf{BZ}} f_{A\pm B}(\mathbf{k},T) \ P_{A\pm B}(\mathbf{k}) \ \delta \left[ E_{A\pm B}(\mathbf{k}) - |E| \right]$$

Teplotní faktory se liší podle typu procesu a jsou dány Bose-Einsteinovou statistikou:

$$f_{A+B}(\mathbf{k},T) = n_A(\mathbf{k},T) + n_B(-\mathbf{k},T) + 1$$
  $f_{A-B}(\mathbf{k},T) = n_B(\mathbf{k},T) - n_A(\mathbf{k},T)$   
 $n_p(\mathbf{k},T) = f^{BE} [E_p(\mathbf{k})] = rac{1}{\exp [E_p(\mathbf{k})/k_{
m B}T] - 1}$ 

Daniel Franta (Ústav fyzikální elektroniky)

Teplotně nezávislá část reprezentuje pravděpodobnost absorpčního procesu (maticové elementy přechodu):

$$P_{A+B}(\mathbf{k}) = \frac{\pi}{\epsilon_0 V|E|} \left(\frac{e\hbar}{m_e}\right)^2 |\langle i, 1, 1|\hat{p}_x|i, 0, 0\rangle|^2,$$
  
$$P_{A-B}(\mathbf{k}) = \frac{\pi}{\epsilon_0 V|E|} \left(\frac{e\hbar}{m_e}\right)^2 |\langle i, 1, 0|\hat{p}_x|i, 0, 1\rangle|^2.$$

Pokud se nebudeme chtít vydat cestou, že z prvních principů budeme vyjadřovat maticové elementy, můžeme ještě na základě topologie ve 3D odvodit Van Hoveovy singularity v kritických bodech.

$$L(E) = \sum_{\boldsymbol{k} \in \mathrm{BZ}} \delta \left[ E_{A \pm B}(\boldsymbol{k}) - |E| \right]$$

	$3D(E_0, E_1, E_2, E_3)$								
		$E_0 \leq E \leq E_1$	$E_1 \leq E \leq E_2$	$E_2 \leq E \leq E_3$					
$M_0$	$L_0(E) =$	$\sqrt{X_{\rm I}(E)}$	$Y_{\rm II}(E)$	0					
$M_1$	$L_1(E) =$	$1 - \sqrt{Y_{\rm I}(E)}$	$Y_{\mathrm{II}}(E)$	0					
$M_2$	$L_2(E) =$	0	$X_{\mathrm{II}}(E)$	$1 - \sqrt{X_{\text{III}}(E)}$					
$M_3$	$L_3(E) =$	0	$X_{ m II}(E)$	$\sqrt{Y_{\rm III}(E)}$					
$X_l(E) = \frac{E - E_{l-1}}{E_l - E_{l-1}},  Y_l(E) = \frac{E_l - E}{E_l - E_{l-1}} \text{ for } E_{l-1}$									

Vícefononové procesy



	$2D(E_0, E_1, E_2)$			$2D(E_1, E_2, E_3)$		
		$E_0 \leq E \leq E_1$	$E_1 \leq E \leq E_2$		$E_1 \leq E \leq E_2$	$E_2 \leq E \leq E_3$
$M_0$	$L_4(E) =$	$Y_{\rm I}(E)$	0	$L_7(E) =$	$Y_{\Pi}(E)$	0
$M_1$	$L_5(E) =$	$-\ln Y_{\rm I}(E)$	$-\ln X_{\mathrm{II}}(E)$	$L_8(E) =$	$-\ln Y_{\mathrm{II}}(E)$	$-\ln X_{\rm III}(E)$
$M_2$	$L_6(E) =$	0	$X_{\mathrm{II}}(E)$	$L_9(E) =$	0	$X_{\mathrm{III}}(E)$





#### Vícefononové procesy

Teplotní faktory můžeme spočítat přesně v kritických bodech, protože energie fononů v kritických bodech nehradíme energiemi fononů ve směrech symetrie.



$$f_{A+B}(E,T) = 1 + f^{BE} [E_A(E)] + f^{BE} [E_B(E)]$$

$$f_{A-B}(E,T) = f^{BE}[E_B(E)] - f^{BE}[E_A(E)]$$

Energie fononu mezi kritickými body je v teplotních faktorech aproximována lineární funkcí:

$$E_{A}(E) = h \left\{ \nu_{A(M_{0})} Y_{I}(E) + \nu_{A(M_{1})} \left[ X_{I}(E) + Y_{II}(E) \right] + \nu_{A(M_{2})} \left[ X_{II}(E) + Y_{III}(E) \right] \right. \\ \left. + \nu_{A(M_{3})} X_{III}(E) \right\} \left[ 1 + \nu_{T}(T - 300) \right]$$



# Tří a čtyřfononové procesy

- Postupujeme obdobně jako u dvoufononových procesů, ale sčítáme dvakrát nebo třikrát přes Brillouinovu zónu.
- Uvažujeme jen součtové větve, kde se absorpčním procesem vytvoří tři fonony o přibližně stejné energii.
- Používáme zjednodušený model, kde modelujeme sdruženou hustotu stavů v příslušném intervalu.
- Obdržíme jiné teplotní faktory, které aproximujeme následovně:

$$f_{3ph}(T) = 1 + 3f^{BE}(E_{3ph}/3, T) + 3[f^{BE}(E_{3ph}/3, T)]^2$$

 $f_{\rm 4ph}(T) = 1 + 4f^{\rm BE}(E_{\rm 4ph}/4, T) + 6[f^{\rm BE}(E_{\rm 4ph}/4, T)]^2 + 4[f^{\rm BE}(E_{\rm 4ph}/4, T)]^3$ 

• Teplotně závislý experiment nám umožňuje odlišit jednotlivé procesy.

